C-7

高い基板温度および超高真空を目指した PLD 装置の立上げと YbFe₂O₄薄膜作製と結晶評価

Fabrication of Pulsed Laser Deposition system for high substrate temperature and high vacuum, and preparation of YbFe₂O₄ thin film using the system

〇車井健慎¹, 田村怜大¹, 吉原大道², 横川泰士², 谷利優斗², 岩田展幸³ *Kenshin Kurumai¹, Reo Tamura¹, Daido Yoshiwara², Taishi Yokokawa², Yuto Tanikaga², Nobuyuki Iwata³

Abstract: We introduced the new deposition system and prepared YbFe₂O₄ film on the surface *c*-plane sapphire substrate using pulsed laser deposition (PLD) method. By introducing, the pressure in chamber is improved 6.1×10^{-7} Pa. From the result of X-ray diffraction 2θ - θ spectrum, It shown not only YbFe₂O₄ peaks but also Fe₃O₄ peaks.

1.背景・目的

*R*Fe₂O₄(*R*=Y, Dy-Lu, Sc, In)は, Fe²⁺と Fe³⁺の秩序化を起源とする電子型強誘電体として知られている^[1]. Fe イオンの 電荷秩序とスピン秩序に相関が存在するため電気磁気効果も観測されている^[2-3]. *R*Fe₂O₄は電子が電気分極を担うため, 高速動作かつ低エネルギーで繰り返し耐久性が高いと期待している. *R*原子に Yb を選択し,新たに立ち上げたパルス レーザー堆積装置を用いて YbFe₂O₄薄膜の作製を試みた.

2. 実験方法

YbFe₂O₄薄膜の作製には非常に低い酸素分圧が必要であることが知られている⁽⁴⁾.新たな 成膜装置の導入により、精密に酸素分圧を制御でき、高品質な YbFe₂O₄エピタキシャル薄 膜の作製が可能になる. ロードロックシステムの導入,および超高真空赤外線ランプヒー ター導入により到達真空度 6.1×10⁷Pa,到達基板温度 900℃を達成した.

Figure 1 に成膜後の YbFe₂O₄ターゲット写真を示す. ターゲットの自転・公転プログラ ムの作成により、ターゲット全体にわたり均一なアブレーションを実現した.



c-Al₂O₃ 基板をアセトン 5 分, 15 分, エタノール 5 分で超音波洗浄を行い, 1050℃で 12 時間大気アニール処理を行った.パルスレーザー堆積法(Pulsed Laser Deposition:PLD 法) にて *c*-Al₂O₃ 基板上に YbFe₂O₄ 薄膜を成膜した.成膜条件は成膜温度 820℃,レーザーエ ネルギー密度 5.0J/cm²,背圧 2.1×10⁵Pa,酸素分圧 1.0×10⁵Pa,成膜時圧力 2.3×10⁴Pa, 成膜時間 1 時間とした.

3. 結果·考察

Figure 2 に 2*0*-*θ* 測定の結果を示す. YbFe₂O₄(0003), (0006), (0009), (00012)が観測された. しかし, Fe₃O₄(022), (044), (066)のピークも観測 された. 酸素過多な条件下では YbFeO₃ や Yb₂O₃, Fe₃O₄ が成長することが知 られている^[4]. 酸素分圧が高かったため, Fe₃O₄ が結晶成長したと考えてい る.

4. まとめ

本研究では新しい PLD 装置の立上げを行い、c-Al₂O₃ 基板上に YbFe₂O₄ 薄膜の作製し結晶評価を行った. X線回折 2 θ 御測定により YbFe₂O₄だけでなく、Fe₃O₄ が成長していたことがわかった. 成膜時の酸素分圧が過剰であったため、Fe₃O₄が結晶成長したと考察する.

5. 参考文献

[1] N. Ikeda et al., Nature 436 1136 (2005).

[2] T. Kambe et al., Phys. Rev. Lett. 110 117602 (2013).

[3] F. Wang et al., J. Phys,: Condens. Matt. 22 496001 (2010). [4] J. Tanaka et al., Jpn. J. Appl. Phys. 58 SLLB11 (2019).

1:日大理工・院(前)・電子工 2:日大理工・学部・電子工 3:日大理工・教員・電子工

Figure 1. 成膜後の YbFe₂O₄ ターゲ ットの写真. ターゲット全体にわたり 均一なアブレーションを実現した.



Figure 2. 200測定の結果. YbFe₂O₄(0003), (0006), (0009), (00012)が観測された. しかし, Fe₃O₄(022), (044), (066)が観測された.